

**EXTREME  
SURFACE**

**1nm**

## Nouvel équipement ToF-SIMS

Le ToF-SIMS est une technique d'analyse d'extremes surfaces par spectrométrie de masse qui permet d'identifier les composants chimiques d'un matériau à l'échelle nanométrique. Ce nouvel appareil offre une haute résolution spatiale, une grande sensibilité et permet une analyse chimique de la surface du technicien.

Notre **équipement de pointe** permet

- d'identifier la composition d'une pollution de surface
- de déterminer précisément l'origine de la défaillance
- de valider l'intégrité d'un traitement ou d'une fonctionnalisation de surface

## CARACTÉRISTIQUES IONTOF MS

- Profondeur d'information de 1 nm
- Résolution spatiale élevée (jusqu'à 50 nm)
- Identification élémentaire ou moléculaire
- Une sensibilité élevée (jusqu'à PPM)
- Pour tout type de matériaux (même dur)
- Prélèvement par épingles d'Argent
- Profil dans l'épaisseur et les multicouches
- Cartogramme 3D
- Coupe FIB 40°
- Une grande polyvalence



Maîtrise de l'équipement,  
Interprétation des résultats  
Accompagnement vers la solution.

**Efficacité, Qualité, Solution**

**Novembre  
2023**



**MATERIA  
NOVA**

Contact :

[caracterisations@materia-nova.be](mailto:caracterisations@materia-nova.be)

[www.materia-nova.be](http://www.materia-nova.be)